製 品 仕 様 書	No, IS-9240A	来歷/REV. 7
PRODUCT SPECIFICATION	頁	1/4
標 題 : 9240S シリーズ 2.0 mmピッチ LCD コネクタ	制定年月日 ISSUE DATE	4-15-'03
SUBJECT: SERIES 9240S 2.0 mm pitch LCD connector	改訂年月日 REVISED DATA	2-14-'13

1. 適用範囲

本仕様書は、イリソ電子工業株式会社製9240Sシリーズ2.0 mm ピッチ LCD コやりに関する仕様及び性能上の必要事項について規定する。

2. 形状、寸法及び材質

構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図面による。 $\underline{2-1.}$ 適合 \underline{LCD}

ピッチ: 2.0mm厚さ: 0.3±0.02mm

<u>3. 定格</u>

(1)最大定格電圧 : 125V(AC,DC)

(2)最大定格電流 : 1.0A

(3)使用温度範囲 : -40~+105℃

4.特性

特に性能のある場合を除き性能試験は下記の環境条件にて行う。

常温 : 15~35℃

常湿 : 25~85% RH (相対湿度)

1.Scope

This product specification is applied for IRISO ELECTRONICS CO.,LTD. series 9240 2.0 mm pitch LCD connector.

2. Configurations dimensions and materials

See the product drawing attached.

2-1. Mating LCD

Pitch : 2.0mm
 Thickness : 0.3±0.02mm

3.Rating

(1)Maximum rating voltage: 125 V (AC,DC)

(2)Maximum rating current: 1.0A

(3) Temperature range : $-40 \sim +105$ °C

4.Performance

All performance test, unless otherwise specified, is taken

as per following environmental condition.

Ambient temperature : 15~35℃

Ambient humidity : 25~85%RH (Relative humidity)

4-1.電気的特性

4-1.Electrical performances

<u> </u>		4-1.Electrical periorman	<u>.cs</u>	
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications	
1	接触抵抗	短絡電流 1mA、最大開放電圧 20mV、周波数 1kHz のローレベル	初期値:40mΩ以下	
		抵抗計にて測定する。		
	Contact resistance	It shall be measured by the dry electric circuit specified	Initial $: 40 \mathbf{m} \Omega$ or below	
		as follows; 1mA, 20mV, 1kHz frequency.		
2	耐電圧	コネクタを嵌合した状態にて隣接する極間に AC1000V を1分間	絶縁破壊等異常のない事。	
		印加する。		
	Dielectric Withstanding	AC 1000V shall be applied to the mated connectors for one	Should not have any changes.	
	Voltage	minute between next terminals.		
3	絶縁抵抗	コネクタを嵌合した状態にて隣接する極間に DC500V を印加し、	初期值:1000MΩ以上	
		測定する。	Initial: $1000 \mathrm{M}\Omega$ or more	
	Insulation	DC 500V shall be applied to the mated connectors between next	耐湿試験後:100MΩ以上	
	Resistance	terminals.	After humidity test: $100 \mathrm{M}\Omega$ or more	
4	外観	目視	有害となる割れ、剥がれ、ガタ	
			変形、変色等のない事。	
	Appearance	Visual	Should not have any flaw, scratch,	
			discoloration and crushed.	

4-2.機械的特性 4-2.Functional performance

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	コンタクトの保持力	コンタクトに25mm/分の速度で荷重を加え、コンタクトが	4.9N/極 以上
		ハウジングより抜け始めるまでの荷重を測定する。	
	Contact retention	It shall be pulled to the contact at the speed of 25mm	4.9N/terminal or more.
	force	per minute, and measure the force when the contact	
		begins to remove from the housing.	
2	金具の保持力	金具に 25mm/分の速度で荷重を加え、金具がベースより抜け始	2.9N/極 以上
		めるまでの荷重を測定する。	
	Mounting retention	It shall be pushed to the mounting at the speed of 25mm	2.9N/terminal or more
	force	per minute, and measured the force when the mounting	
	WENCE LETT T	begins to remove from the housing.	知知 aघ 10 ロステ (光杯)
3	繰り返し挿抜力1	コネクタと LCD を 25mm/分の速度で挿抜を行ない、この時の荷	初期、6回、10回にて(単極)
	T	重を測定する。	挿入力: 4.41N/極 以下
	Insertion/extraction	The connector and LCD shall be mated and unmated at	抜去力: 0.49N/極以上
	force 1	the speed of 25mm per minute and measured the	Initial and 6th,10th (pre-terminal)
	force of insertion and extraction.		Insertion force: 4.41N or
ļ			below / terminal
			Extraction force: 0.49N or
- 4	知りに1 任仕上り	コシャカししのマロニー(ハの古中で10回帰りにし任用さた)	more / terminal
4	繰り返し挿抜力2	コネクタと LCD を 25mm/分の速度で 10 回繰り返し挿抜を行な	接触抵抗:100mΩ以下
	Insertion/extraction	い、この時接触抵抗を測定する。 The connector and LCD shall be mated and unmated	Contact Resistance : $100 \text{m} \Omega$ or below
	force 2		Contact Resistance . 100H12 or below
	101Ce Z	10 times at the speed of 25mm per minute and measured the contact resistance.	
		the contract resistance.	

		1			
No.	IS-9240A	来歷/REV.	7	頁/Page	2/4

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
5	温度上昇	コネクタとLCDを嵌合した状態全極を直列に接続させ、最大許容電	30℃以下
		流(1A)を通電し、テール部の温度上昇分を測定する。(端子部温	
	Temperature Raise	度は室温を差し引いた値をする。)	30℃ Max.
		The connector and LCD shall be mated. And the maximum	
		current (1A) shall be applied to it, measure the temperature	
		raise at the tail point.	
6	耐振動試験	コネクタと LCD を嵌合した状態にて、振動周波数 20~200~20Hz	試験中1μs 以上の瞬断のない事。
		毎3分、加速度 4.9m/s²のいずれか小さい方にて XYZ 軸方向に各3	接触抵抗:100mΩ以下
	Vibration test	時間計9時間の振動を加える。試験中、瞬断の有無の確認、試験後の	外観異常なき事
		接触抵抗の測定及び外観観察をする。	
		The connector and LCD mated is vibrated in the frequency r	Discontinuity : $1 \mu s$ or less
		ange of 20~200~20Hz per 3 minutes and in the constant vi	Contact Resistance: $100 \text{m}\Omega$ or be
		bration the acceleration of 4.9m/s ² . The amplitude or the acce	The appearance should not have a
		leration above shall be chosen either one under which the co	changes.
		nnectors is loaded more slightly. And this motion is applied f	
		or period of 3hours in 3 mutually perpendicular directions(X,	
		Y,Z-axis).It shall be tested the discontinuity of the contact cur	
		rent during the test and measured the contact resistance and	
		observed its appearance after the test.	
7	耐衝擊試験	コネクタと LCD を嵌合した状態にて、治具に取付け、加速度 980m	試験中1μs 以上の瞬断のない事。
		/s ² (100G)、衝撃作用時間 11ms を X,Y,Z 方向の 6 面に各 3 回	接触抵抗:100mΩ以下
	Shock test	加える。試験中瞬断の有無の確認及び、試験後接触抵抗を測定する。	外観異常なき事
		The connector LCD mated is installed in the machine. They	/ L M/大田/みしず
		are applied pulses 3 times to each 6 faces of 3 multilateral	Discontinuity : $1 \mu s$ or less
		perpendicular directions(X,Y,Z); in conditions as specified;	Contact Resistance: $100 \text{m} \Omega$ or bel
		acceleration of 980m/s ² (100G) and shock pulses for a	The appearance should not have a
		duration of 11ms. It shall be tested the discontinuity of the	changes.
		contact current during the test and measured the contact re	cnanges.
		sistance after the test.	
4-3.現		4-3.Environmental perform	nance
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	耐熱性	コネクタと LCD を嵌合した状態にて、温度 105±2℃の恒温槽中に	接触抵抗:100mΩ以下
		500 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。	外観異常なき事
	Heat resistance	The connector and LCD mated is exposed in the heat	
		chamber 105±2°C for 500 hours. It shall be measured the	Contact Resistance: $100 \text{m} \Omega$ or bel
		contact resistance after the test.	The appearance should not have ar
			changes
2	Tribe Lei	コネクタと LCD を嵌合した状態にて、温度 -40±2℃の雰囲気中に	接触抵抗:100mΩ以下
4	耐寒性		
_	耐寒性	192 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。	外観異常なき事
-	耐寒性 Cold Test	192 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the heat	外観異常なき事
-			
_		The connector and LCD mated is exposed in the heat	Contact Resistance: $100 \text{m}\Omega$ or bel
_		The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber $-40\pm2^{\circ}\!$	Contact Resistance: $100 \text{m}\Omega$ or bel
3	Cold Test	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber -40 ± 2 °C for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	Contact Resistance: $100m\Omega$ or bel The appearance should not have an changes
		The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber −40±2°C for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、温度 65±2°C、相対湿度 90~95%	Contact Resistance: $100 \text{m}\Omega$ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: $100 \text{m}\Omega$ 以下
	Cold Test 耐湿性	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber −40±2°C for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、温度 65±2°C、相対湿度 90~95% RH の恒温恒湿槽中に 192 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。	Contact Resistance: $100m\Omega$ or bel The appearance should not have an changes
	Cold Test	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber −40±2°C for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、温度 65±2°C、相対湿度 90~95% RH の恒温恒湿槽中に 192 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the humidity ch	Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have ar changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事
	Cold Test 耐湿性	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber −40±2°C for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、温度 65±2°C、相対湿度 90~95% RH の恒温恒湿槽中に 192 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the humidity chamber 62±2°C, 90~95%RH for 192 hours. It shall be	Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have ar changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel
	Cold Test 耐湿性	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber −40±2°C for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、温度 65±2°C、相対湿度 90~95% RH の恒温恒湿槽中に 192 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the humidity ch	Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have ar changes 接触抵抗: 100mΩ以下外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an
3	Cold Test 耐湿性 Humidity	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber −40±2°C for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、温度 65±2°C、相対湿度 90~95% RH の恒温恒湿槽中に 192 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the humidity chamber 62±2°C, 90~95%RH for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have ar changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have ar changes
	Cold Test 耐湿性	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber −40±2°C for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、温度 65±2°C、相対湿度 90~95% RH の恒温恒湿槽中に 192 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the humidity chamber 62±2°C, 90~95%RH for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、槽内温度 35±2°C、濃度 5±	Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have ar changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have ar changes 接触抵抗: 100mΩ以下
3	Cold Test 耐湿性 Humidity 塩水噴霧試験	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber −40±2°C for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、温度 65±2°C、相対湿度 90~95% RH の恒温恒湿槽中に 192 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the humidity chamber 62±2°C, 90~95%RH for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、槽内温度 35±2°C、濃度 5±1%の塩水噴霧中に 48 時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を	Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have ar changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have ar changes
3	Cold Test 耐湿性 Humidity	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber −40±2°C for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、温度 65±2°C、相対湿度 90~95% RH の恒温恒湿槽中に 192 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the humidity chamber 62±2°C, 90~95%RH for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、槽内温度 35±2°C、濃度 5±1%の塩水噴霧中に 48 時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を測定する。	Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have ar changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have ar changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事
3	Cold Test 耐湿性 Humidity 塩水噴霧試験	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber −40±2°C for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、温度 65±2°C、相対湿度 90~95% RH の恒温恒湿槽中に 192 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the humidity chamber 62±2°C, 90~95%RH for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、槽内温度 35±2°C、濃度 5±1%の塩水噴霧中に 48 時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the salt spray	Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel
3	Cold Test 耐湿性 Humidity 塩水噴霧試験	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber −40±2°C for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、温度 65±2°C、相対湿度 90~95% RH の恒温恒湿槽中に 192 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the humidity chamber 62±2°C, 90~95%RH for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、槽内温度 35±2°C、濃度 5±1%の塩水噴霧中に 48 時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the salt spray Chamber 35±2°C, 5±1% salt density for 48 hours. It shall	Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an
3	Test 耐湿性 Humidity 塩水噴霧試験 Salt spray test	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber −40±2°C for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、温度 65±2°C、相対湿度 90~95% RH の恒温恒湿槽中に 192 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the humidity chamber 62±2°C, 90~95%RH for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、槽内温度 35±2°C、濃度 5±1%の塩水噴霧中に 48 時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the salt spray Chamber 35±2°C, 5±1% salt density for 48 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have ar changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have ar changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have ar changes
3	Cold Test 耐湿性 Humidity 塩水噴霧試験	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber −40±2°C for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、温度 65±2°C、相対湿度 90~95% RH の恒温恒湿槽中に 192 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the humidity chamber 62±2°C, 90~95%RH for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、槽内温度 35±2°C、濃度 5±1%の塩水噴霧中に 48 時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the salt spray Chamber 35±2°C, 5±1% salt density for 48 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、温度 40±2°C, 相対湿度 75%	Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下
3	Test 耐湿性 Humidity 塩水噴霧試験 Salt spray test	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber −40±2°C for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、温度 65±2°C、相対湿度 90~95% RH の恒温恒湿槽中に 192 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the humidity chamber 62±2°C, 90~95%RH for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、槽内温度 35±2°C、濃度 5±1%の塩水噴霧中に 48 時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the salt spray Chamber 35±2°C, 5±1% salt density for 48 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have ar changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have ar changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have ar changes
3	Test 耐湿性 Humidity 塩水噴霧試験 Salt spray test	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber −40±2°C for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、温度 65±2°C、相対湿度 90~95% RH の恒温恒湿槽中に 192 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the humidity chamber 62±2°C, 90~95%RH for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、槽内温度 35±2°C、濃度 5±1%の塩水噴霧中に 48 時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the salt spray Chamber 35±2°C, 5±1% salt density for 48 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、温度 40±2°C, 相対湿度 75%	Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下
3	Test 耐湿性 Humidity 塩水噴霧試験 Salt spray test	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber −40±2°C for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、温度 65±2°C、相対湿度 90~95% RH の恒温恒湿槽中に 192 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the humidity chamber 62±2°C, 90~95%RH for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、槽内温度 35±2°C、濃度 5±1%の塩水噴霧中に 48 時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the salt spray Chamber 35±2°C, 5±1% salt density for 48 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、温度 40±2°C、相対湿度 75% RH、濃度 50±5ppm.の雰囲気中に 24 時間放置し、放置後接触抵抗	Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下外観異常なき事
3	Test 耐湿性 Humidity 塩水噴霧試験 Salt spray test	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber −40±2°C for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、温度 65±2°C、相対湿度 90~95% RH の恒温恒湿槽中に 192 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the humidity chamber 62±2°C, 90~95%RH for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、槽内温度 35±2°C、濃度 5±1%の塩水噴霧中に 48 時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the salt spray Chamber 35±2°C, 5±1% salt density for 48 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、温度 40±2°C, 相対湿度 75% RH、濃度 50±5ppm.の雰囲気中に 24 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the SO₂ gas chamber 40	Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have ar changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have ar changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have ar changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have ar changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事
3	Test 耐湿性 Humidity 塩水噴霧試験 Salt spray test	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber −40±2°C for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、温度 65±2°C、相対湿度 90~95% RH の恒温恒湿槽中に 192 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the humidity chamber 62±2°C, 90~95%RH for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、槽内温度 35±2°C、濃度 5±1%の塩水噴霧中に 48 時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the salt spray Chamber 35±2°C, 5±1% salt density for 48 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、温度 40±2°C、相対湿度 75% RH、濃度 50±5ppm.の雰囲気中に 24 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the SO₂ gas chamber 40±2°C、75%RH 50±5ppm for 24 hours. It shall be measured	Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have ar changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have ar changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have ar changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have ar changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事
3	Test 耐湿性 Humidity 塩水噴霧試験 Salt spray test SO ₂ ガス試験 SO ₂ gas test	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber −40±2°C for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、温度 65±2°C、相対湿度 90~95% RH の恒温恒湿槽中に 192 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the humidity chamber 62±2°C, 90~95%RH for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、槽内温度 35±2°C、濃度 5±1%の塩水噴霧中に 48 時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the salt spray Chamber 35±2°C, 5±1% salt density for 48 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、温度 40±2°C, 相対湿度 75% RH、濃度 50±5ppm.の雰囲気中に 24 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the SO₂ gas chamber 40±2°C,75%RH 50±5ppm for 24 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事
3	Test 耐湿性 Humidity 塩水噴霧試験 Salt spray test	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber −40±2°C for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、温度 65±2°C、相対湿度 90~95% RH の恒温恒湿槽中に 192 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the humidity chamber 62±2°C, 90~95%RH for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、槽内温度 35±2°C、濃度 5±1%の塩水噴霧中に 48 時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the salt spray Chamber 35±2°C, 5±1% salt density for 48 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、温度 40±2°C, 相対湿度 75% RH、濃度 50±5ppm.の雰囲気中に 24 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the SO₂ gas chamber 40±2°C,75%RH 50±5ppm for 24 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、濃度 28%アンモニア水を入れた雰囲	Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下
3	Test 耐湿性 Humidity 塩水噴霧試験 Salt spray test SO ₂ ガス試験 SO ₂ gas test 耐アンモニアガス性	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber −40±2°C for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、温度 65±2°C、相対湿度 90~95% RH の恒温恒湿槽中に 192 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the humidity chamber 62±2°C, 90~95%RH for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、槽内温度 35±2°C、濃度 5±1%の塩水噴霧中に 48 時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the salt spray Chamber 35±2°C, 5±1% salt density for 48 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、温度 40±2°C, 相対湿度 75% RH、濃度 50±5ppm.の雰囲気中に 24 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the SO₂ gas chamber 40±2°C,75%RH 50±5ppm for 24 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、濃度 28%アンモニア水を入れた雰囲気中に 40 分間放置し、放置後接触抵抗を測定する。	Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事
3	Test 耐湿性 Humidity 塩水噴霧試験 Salt spray test SO2ガス試験 SO2 gas test 耐アンモニアガス性 Resisting Ammonia	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber −40±2°C for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、温度 65±2°C、相対湿度 90~95% RH の恒温恒湿槽中に 192 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the humidity chamber 62±2°C, 90~95%RH for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、槽内温度 35±2°C、濃度 5±1%の塩水噴霧中に 48 時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the salt spray Chamber 35±2°C, 5±1% salt density for 48 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、温度 40±2°C, 相対湿度 75% RH、濃度 50±5ppm.の雰囲気中に 24 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the SO₂ gas chamber 40±2°C,75%RH 50±5ppm for 24 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、濃度 28%アンモニア水を入れた雰囲気中に 40 分間放置し、放置後接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in chamber with	Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下外観異常なき事
3	Test 耐湿性 Humidity 塩水噴霧試験 Salt spray test SO ₂ ガス試験 SO ₂ gas test 耐アンモニアガス性	The connector and LCD mated is exposed in the heat chamber −40±2°C for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、温度 65±2°C、相対湿度 90~95% RH の恒温恒湿槽中に 192 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the humidity chamber 62±2°C, 90~95%RH for 192 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、槽内温度 35±2°C、濃度 5±1%の塩水噴霧中に 48 時間放置し、放置後水洗、乾燥し接触抵抗を測定する。 The connector and LCD mated is exposed in the salt spray Chamber 35±2°C, 5±1% salt density for 48 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタと LCD を嵌合した状態にて、温度 40±2°C, 相対湿度 75% RH、濃度 50±5ppm.の雰囲気中に 24 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the SO₂ gas chamber 40±2°C,75%RH 50±5ppm for 24 hours. It shall be measured the contact resistance after the test. コネクタを嵌合した状態にて、濃度 28%アンモニア水を入れた雰囲気中に 40 分間放置し、放置後接触抵抗を測定する。	Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下 外観異常なき事 Contact Resistance: 100mΩ or bel The appearance should not have an changes 接触抵抗: 100mΩ以下

No. IS-9240A 来歷/REV. 7 頁/Page 3/4

N	o. 項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications	
7	冷熱衝擊試験	コネクタと LCD を嵌合させ、下図の温度条件を 1 サイクルとして	接触抵抗:100mΩ以下	
		1000 サイクル実施し、500、1000 サイクル試験後接触抵抗を測定		
	Thermal shock test	する。	Contact Resistance: $100 \text{m} \Omega$ or below	
		The connector mated is exposed 1000 cycles in the following		
		temperature 10 cycles in the following figure. It shall be		
		measured the contact resistance at 500,1000th cycles.		
		+105±2℃		
		30min		
		Ambient 常温 temperature		
		常温 temperature 30min		
		30min		
		-30±3℃		
		lcycle —		
		Toyote		
8	温湿度サイクル試験	コネクタと LCD を嵌合した状態で、下図の温湿度条件を1サイクル	接触抵抗:100mΩ以下	
		として、10 サイクル実施し、試験後の接触抵抗を測定する。	外観異常なき事	
	Humidity Resistance	The connector and LCD mated is exposed 10 cycles in the fol		
	(cycling)	lowing conditions. It shall be measured the contact	Contact Resistance: $100 \text{m}\Omega$ or below	
		resistance after the test.	The appearance should not have any	
			changes	
		+80±2°C		
		90~95%RH		
	•	20 1 200		
		-20±3℃		
		€ 2 0h → € 2 0h → € 2 0h →		
		< 2.0h > < 2.0h > < 2.0h > < 2.0h >		
		1 cycle		
		- 5,555		

4-4.その他の特性	4-4.Other performance
4-4.で (2)10(2)付注	4-4,Other performance

4-4.	その他の特性	4-4. Other performance			
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications		
1	半田付け性	コネクタの半田付部をフラックスに浸漬した後、230±5℃の Sn-Ag-Cu 系	浸した面積の 95%以上に半田が むらな		
		$igg $ の鉛フリー槽に 3 ± 0.5 秒浸す。	く付着する事。		
	Solder Ability	The terminal of connector shall be put into the flux and dipped			
		into Pb free solder bath(Type of Sn-Ag-Cu) 230 ± 5 °C, 3 ± 0.5 s.	Solder shall be covered 95% or more of		
			the area that is dipped into the solder bath.		
2	半田耐熱性	下記条件にて、半田耐熱性試験を行う。	端子のガタ、割れ等異常のない事。		
ŀ		The connector shall be tested soldering heat test in the following			
	Resistance to	conditions.	Should not have any flaw, scratch and		
	soldering heat	条件①: リフローの場合/in case of reflow	crack.		
		<u>240℃ (ピーク</u> 温度/peak temperature)			
		200°CMIN (40s.MAX.) 予熱/pre-heat			
		150~180°C			
		リフロー回数:2 回/reflow times:Twice			
		温度は製品上面の温度とする。			
		The temperature shall be measured on the surface of the product.			
		条件②:手半田の場合/In case of manual soldering.			
		半田鏝温度/Solder iron : 350±5℃			
		時間/time : 3±0.5s			

| No. | IS-9240A | 来歴/REV. | 7 | 頁/Page | 4/4

5. 保管条件

室内で−10~+40℃の温度、75%RH 以下の相対湿度の 保管条件にて製造日より1年間。

6. ウィスカーに関して 1

本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、ウィスカーが発生する可能性がございます。その為、ウィスカー発生に対する保証は困難であり、御社にて御判断の上御使用をお願いします。

7. 故障率

MIL-HDBK-217D,2-11,2 プリント配線板コネクタに基づいて 算出を行う。(単位: FIT)

5. Storage condition

Shall be storaged in the house at $-10 \sim +40$ °C, 75%RH or less. 1 year from product day.

6. About a whisker 1

This product utilizes lead-free tin plating. Any product with lead-free tin plating is susceptible to tin whisker. Iriso provides no assurances against the growth of tin whisker even under normal operating conditions. Customers assume all responsibility for any product failures due solely to the growth of tin whiskers.

7.Failure rate

Failure rate shall be calculated as MIL-HDBK-217D,2-11,2 (Unit : FIT)

	極数	故障率	極数	故障率	極数	故障率	極数	故障率
Δ	6	1.07	16	1.81				
	11	1.43						
	15	1.73						

8. 和文と英文の差異について 🛧

和文と英文の内容に差異が生じた場合には、和文の内容を優先致します。

8. Difference between Japanese and English 🗥

When difference is found between Japanese specifications and English specifications, priority shall be given to Japanese.